

# ICP-OES DUAL VIEW L'ATTESA È FINITA

The Measure of Confidence

## ICP-OES Agilent 5100



## Il sistema ICP-OES più veloce al mondo.

Il sistema ICP-OES Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) rivoluziona l'analisi ICP-OES. Grazie all'esclusiva tecnologia Dichroic Spectral Combiner (DSC) è oggi possibile eseguire contemporaneamente analisi in visione radiale e in visione assiale.

### Riduci tempi e costi

- Esegui l'analisi ICP-OES più rapida possibile, usando meno gas.
- Analizza tutte le lunghezze d'onda in un'unica analisi, per una precisione superiore senza ritardi.
- Inizia a lavorare prima con il rivelatore Vista Chip II a zero gas che riduce il tempo di riscaldamento.

### Prestazioni sempre costanti

- Misura i tuoi campioni più difficili con una torcia verticale.
- Ottieni una stabilità analitica a lungo termine con il sistema di generazione di radio frequenza (RF) allo stato solido.

### Semplifica la tua analisi

- Elimina ogni incognita dallo sviluppo del metodo grazie al software intuitivo ICP Expert e alla tecnologia DSC.
- I potenti algoritmi del software semplificano lo sviluppo del metodo, migliorano l'accuratezza e ampliano il tuo intervallo di misura.

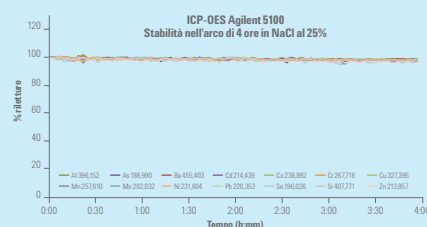
### Configurazioni flessibili

Il sistema Agilent 5100 è disponibile in tre configurazioni:

- Dual view sincrono con torcia verticale.
- Dual view con torcia verticale.
- Visione radiale.

## ROBUSTO E SOLIDO

Grazie alla torcia verticale e al sistema RF in qualsiasi configurazione, il sistema ICP-OES 5100 gestisce con facilità i campioni più difficili.



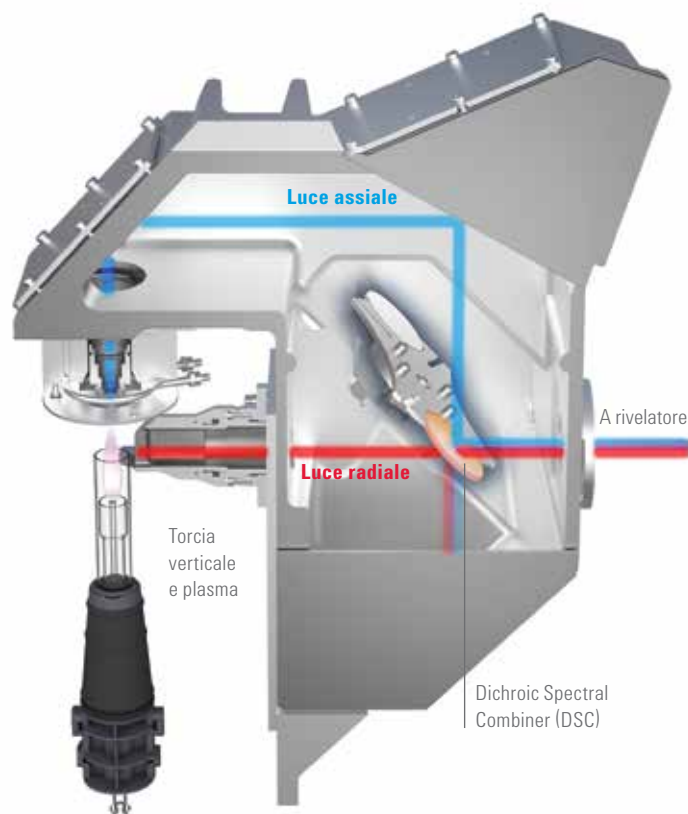
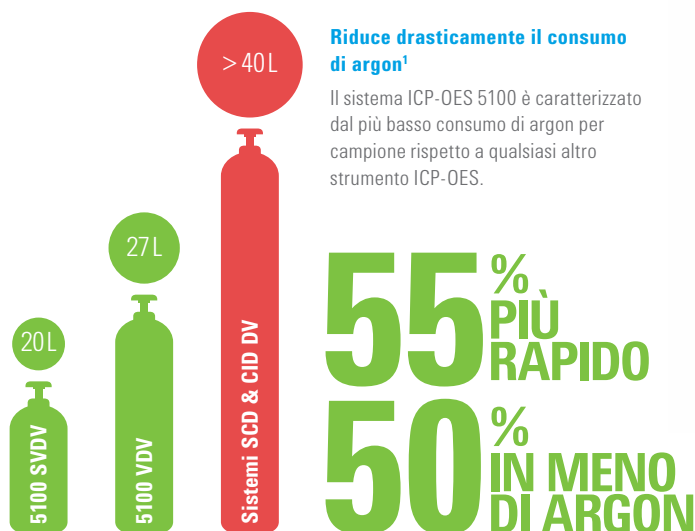
Il grafico riporta la percentuale delle riletture su un intervallo di elementi in soluzione di NaCl al 25%. Per tutti gli elementi, la stabilità delle riletture nell'arco di 4 ore è stata <1,3% RSD, senza standardizzazione interna.



Agilent Technologies

## Come funziona il sistema dual view sincrono con torcia verticale?

Il sistema ICP-OES 5100 SVDV richiede una sola misura per campione. Il Dichroic Spectral Combiner consente di catturare in un'unica lettura sia la visione assiale che quella radiale del plasma. Ciò consente di ottenere risultati accurati nel più breve tempo possibile<sup>1</sup>.



### LO SAPEVI CHE...

I sistemi ICP-OES dual view convenzionali necessitano dell'impostazione da parte dell'operatore di misure sequenziali, che prevedono la selezione degli elementi da misurare in modalità assiale e gli elementi da misurare in modalità radiale.

Inoltre, alcuni sistemi utilizzano due fenditure per misurare le lunghezze d'onda alte e basse, portando così a un massimo di quattro le misurazioni sequenziali eseguite su ogni campione, con conseguente diminuzione della produttività per campione.

1. Le cifre relative alla velocità di analisi e al consumo di gas sono riferite al confronto con sistemi analoghi di altri produttori, in base ai dati delle applicazioni pubblicati. Vedere la nota applicativa Agilent 5991-4821EN

Per ulteriori informazioni  
Rivolgersi al rappresentante Agilent  
della propria zona oppure visitare il sito:  
**[www.agilent.com/chem/5100icpoes](http://www.agilent.com/chem/5100icpoes)**

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2014  
Pubblicato il 1 luglio 2014  
5991-48351TE

